**Якименко, Игорь Юрьевич. Диагностика структур на основе InGaAsP/InP методом комбинационного рассеяния света : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Рос. АН Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе.- Санкт-Петербург, 1994.- 17 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-2/31-5**